DOMESTIC PRIORITY INFORMATION

Application::

Continuity Type::

Parent Application::

Parent Filing Date::

FOREIGN APPLICATION INFORMATION

Country::

Application Number:: Filing Date::

Priority Claimed

Japan

2001-251434

08/22/01

Yes

ASSIGNEE INFORMATION

Assignee name::

Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha

Street of mailing address:: 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku

City of mailing address::

Tokyo

State or Province of mailing address::

Country of mailing

address::

Japan

Postal or Zip Code of

mailing address::

100-8310

PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

国

本

JAPAN

日

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 8月22日

号 番 出願

特願2001-251434 Application Number:

人 願 出 Applicant(s):

三菱電機株式会社

2001年 9月 6日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 533337JP01

【提出日】 平成13年 8月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01P 5/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】 有吉 雄二

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】 100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】 河宮 治

【選任した代理人】

【識別番号】 100098280

【弁理士】

【氏名又は名称】 石野 正弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

明細書 【書類名】

流量測定装置 【発明の名称】

【特許請求の範囲】

流体中に配置され、熱を発する発熱体の上流側の放熱量と、 【請求項1】 下流側の放熱量との差から、流体の流量を測定する流量測定装置において、

該発熱体の上流側に設けられて温度を検出する上流温度検出体と、

該発熱体の下流側に設けられて温度を検出する下流温度検出体と、

前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度検出体が検出した 温度の平均温度が、予め設定された温度になるように、前記発熱体に供給する電 力を制御する回路と

を備えた、流量測定装置。

前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度 検出体が検出した温度の温度差に基づいて、流体の流量を測定する、請求項1に 記載の流量測定装置。

前記発熱体、および、前記上流温度検出体の間に設けられ、 【請求項3】 前記回路から供給された電力に基づいて熱を発する上流発熱体と、

前記発熱体、および、前記下流温度検出体の間に設けられ、前記回路から供給 された電力に基づいて熱を発する下流発熱体と

前記回路は、前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度検出 体が検出した温度が等しくなるように、前記上流発熱体および前記下流発熱体に 供給する電力を制御し、該電力の差に基づいて、流体の流量を測定する、請求項 1に記載の流量測定装置。

前記回路は、流体の温度に基づいて、前記予め設定された温 【請求項4】 度を変化させる、請求項1~3に記載の流量測定装置。

【請求項5】 前記回路は、流体の流量に基づいて、前記予め設定された温 度を変化させる、請求項1~3に記載の流量測定装置。

【請求項6】 流体中に配置され、熱を発する発熱体の上流側の放熱量と、 下流側の放熱量との差から、流体の流量を測定する流量測定装置において、

流体の上流側から下流側にかけて、各々が、熱を発する発熱体および温度を検 出する温度検出体の機能を有する第1、第2、第3、第4、第5、第6の感温抵 抗体と、感温抵抗体を発熱させる電力の供給を制御する回路を備えた、流体の流 量を測定する流量測定装置であって、

回路は、第2、第5の感温抵抗体の発熱温度が等しくなるように、第3、第4 の感温抵抗体に供給する電力を制御し、さらに、第1、第6の感温抵抗体の発熱 温度が等しくなるように、第2、第5の感温抵抗体に供給する電力を制御し、第 3、第4の感温抵抗体に供給される電力の差と、第2、第5の感温抵抗体に供給 される電力の差とに基づいて、流体の流量を測定する流量測定装置。

【請求項7】 前記第3と第4の発熱体の間に、発熱抵抗体をさらに備え、 回路は、前記第1の発熱体と第6の発熱体の平均温度が予め設定された温度に なるように、前記発熱抵抗体に供給する電力を制御する、請求項7に記載の流量 測定装置。

前記回路は、流体の温度に基づいて、前記予め設定された温 【請求項8】 度を変化させる、請求項6または7に記載の流量測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、流体の流量の測定に関する。

[0002]

【従来の技術】

流体の流量を測定する方式は、大きく2種類に分けることができる。すなわち 、加熱電流検出方式と、温度差検出方式である。

[0003]

加熱電流検出方式は、流体中に設けられたヒーターを、流体温度に対して一定 温度だけ高く保つのに必要な加熱電流を検出して、流体の流量を測定する。一方 の温度差検出方式は、発熱抵抗体の温度を一定に保ち、その上流側に形成された 上流側温度検出抵抗体と、下流側に形成された下流側温度検出抵抗体との温度差 を検出して、流体の流量を測定する。温度差検出方式を採用する流体流量測定装 置は例えば特公平5-7659に示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

上述した従来の2つの方式には、それぞれ以下のような欠点が存在する。

[0005]

具体的には、加熱電流検出方式を採用する流体流量測定装置では、小型化に適さず、かつ、小さな流量域の流量を測定することが困難である。

[0006]

温度差検出方式を採用する流体流量測定装置では、小型化、および、小さい流量域の流量の測定が可能であるが、流体流量が大きくなると上流側温度検出抵抗体の温度がそれ以上低下しなくなり、また、下流側温度検出抵抗体の温度も低下を始める。よって大流量域で感度が低下し、ダイナミックレンジを大きく取れない。また、流量変化により温度検出抵抗体の温度が変化するため、応答性が悪い

[0007]

本発明の目的は、小型化が可能で、感度および応答性が高く、かつ、ダイナミックレンジが広い流体流量測定方式を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明による流量測定装置は、流体中に配置され、熱を発する発熱体の上流側の放熱量と、下流側の放熱量との差から、流体の流量を測定する流量測定装置であって、該発熱体の上流側に設けられて温度を検出する上流温度検出体と、該発熱体の下流側に設けられて温度を検出する下流温度検出体と、前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度検出体が検出した温度の平均温度が、予め設定された温度になるように、前記発熱体に供給する電力を制御する回路とを備えている。これにより上記目的が達成される。

[0009]

前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度検出体が検出した 温度の温度差に基づいて、流体の流量を測定してもよい。

3

[0010]

前記発熱体、および、前記上流温度検出体の間に設けられ、前記回路から供給された電力に基づいて熱を発する上流発熱体と、前記発熱体、および、前記下流温度検出体の間に設けられ、前記回路から供給された電力に基づいて熱を発する下流発熱体とをさらに備え、前記回路は、前記上流温度検出体が検出した温度、および、前記下流温度検出体が検出した温度が等しくなるように、前記上流発熱体および前記下流発熱体に供給する電力を制御し、該電力の差に基づいて、流体の流量を測定してもよい。

[0011]

前記回路は、流体の温度に基づいて、前記予め設定された温度を変化させてもよい。

[0012]

前記回路は、流体の流量に基づいて、前記予め設定された温度を変化させてもよい。

[0013]

本発明による流量測定装置は、流体中に配置され、熱を発する発熱体の上流側の放熱量と、下流側の放熱量との差から、流体の流量を測定し、流体の上流側から下流側にかけて、各々が、熱を発する発熱体および温度を検出する温度検出体の機能を有する第1、第2、第3、第4、第5、第6の感温抵抗体と、感温抵抗体を発熱させる電力の供給を制御する回路を備えた、流体の流量を測定する流量測定装置であって、回路は、第2、第5の感温抵抗体の発熱温度が等しくなるように、第3、第4の感温抵抗体に供給する電力を制御し、さらに、第1、第6の感温抵抗体の発熱温度が等しくなるように、第2、第5の感温抵抗体に供給する電力を制御し、第3、第4の感温抵抗体に供給される電力の差と、第2、第5の感温抵抗体に供給される電力の差とに基づいて、流体の流量を測定する。これにより上記目的が達成される。

[0014]

前記第3と第4の発熱体の間に、発熱抵抗体をさらに備え、回路は、前記第1 の発熱体と第6の発熱体の平均温度が予め設定された温度になるように、前記発 熱抵抗体に供給する電力を制御してもよい。

[0015]

前記回路は、流体の温度に基づいて、前記予め設定された温度を変化させても よい。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、添付の図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。図面では、同一の機能を有する構成要素には同一の参照符号を付している。

[0017]

(実施の形態1)

図1は、実施の形態1の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。流体流量測定装置は、シリコン基板1上に形成された薄肉部3に、白金等の感温材料により形成された発熱抵抗体4、温度センサとしての上流側温度検出抵抗体5、および下流側温度検出抵抗体6を備えている。それぞれの抵抗体4、5、6には配線部9が接続され、配線部9の一端にはパッド部10が接続されている。パッド部10は外部回路との接続のため、ワイヤボンディング等に使用される。図2は、図1のA-A'における薄肉部3の断面図である。薄肉部3は、絶縁層7、8とその間に形成された抵抗体4、5、6から形成されている。薄肉部3の裏面側のシリコンはエッチングにより除去され、空洞部2が形成されている。

[0018]

この流体流量測定装置が流体(例えば、空気)の流速を検出する際の動作原理は以下のとおりである。まず、発熱抵抗体4が、シリコン基板1の温度よりも高い温度(例えば、200℃)になるように加熱される。このシリコン基板1の温度は、流れている空気の温度とほぼ同じであると仮定できる。空気の流れがない場合には、発熱抵抗体4からの熱は、上流側温度検出抵抗体5、および、下流側温度検出抵抗体6の双方を均等に加熱する。図に示すように、上流側温度検出抵抗体5、および、下流側温度検出抵抗体6、および、下流側温度検出抵抗体6、および、下流側温度検出抵抗体6、および、下流側温度検出抵抗体6の温度差はなくなり、抵抗差は生じない。一方、空気の流れがある場

合、仮に、図2の「FLOW」と示す矢印の方向に空気の流れがある場合を考える。このとき、上流に位置する上流側温度検出抵抗体5は、発熱抵抗体4方向への空気の流れにより熱が奪われるので冷却され、下流に位置する下流側温度検出抵抗体6は、発熱抵抗体4からの空気の流れにより熱せられる。この温度差により生じる、上流側温度検出抵抗体5、および、下流側温度検出抵抗体6の抵抗値の差が電圧値の差をもたらし、空気の流量、流速が計測される。

図3は、実施の形態1による、抵抗体4、5、6を含む、流体流量測定装置の回路図である。上流側温度検出抵抗体5 (Rsu)と下流側温度検出抵抗体6 (Rsd)には定電流源13が接続され、定電流Isが供給される。抵抗体Rsu5と抵抗体Rsd6の両端電圧 (Vsu,Vsd)は加算回路15に入力される。加算回路15のゲインをGとすると、加算回路の出力電圧Vaddは下記数1で表される。

【数1】

$$V_{add} = Ve - G(Vsu + Vsd)$$

$$[0 0 2 0]$$

固定抵抗R1とR2により定電圧12 (Vc)を分圧した電圧19 (Vt)と、加算回路15の出力電圧Vaddとが比較され、パワートランジスタ20により、両者が等しくなるように発熱抵抗体4に電力が供給される。ここで定電圧Vcを分圧した電圧Vtは下記数2で表される。

【数2】

$$Vt = \frac{R_2}{R_1 + R_2} Vc$$

[0021]

よって、Vt=Vaddとすると、数1および数2から、下記数3が得られる。

【数3】

$$G(Vsu + Vsd) = Ve - \frac{R_2}{R_1 + R_2}Vc$$

[0022]

上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の0℃の時の抵抗値をRs0、抵

抗温度係数を α s、温度をそれぞれTsu、Tsdとすると、Rsu 5 とRsd 6 の両端電 EVsu,Vsdは、それぞれ下記数4 および数5 のように得られ、その結果、下記数6 が得られる。

【数4】

$$Vsu = RsuIs = R_{so}(1 + \alpha_s Tsu)Is$$

【数5】

$$Vsd = RsdIs = R_{s0}(1 + \alpha_s Tsd)Is$$

【数6】

$$G(Vsu + Vsd) = G\{(2R_{s0} + \alpha_s(Tsu + Tsd))\}Is$$
$$= 2GR_{s0}Is + G\alpha_s(Tsu + Tsd)Is$$

[0023]

上述の数3および数6から、下記数7が得られる。

【数7】

$$\frac{1}{2}(Tsu + Tsd) = \left[Ve - \frac{R2}{R1 + R2}Vc - 2GR_{s0}Is\right] / 2G\alpha_sIs$$

[0024]

数7の右辺の各項は全て定数であるから、右辺は定数である。よって、図3に示す回路を構成することにより、上流側温度検出抵抗体5の温度(Tsu)と下流側温度検出抵抗体の温度(Tsd)の平均値を一定に保つことができる。

さらに図3を参照して、上流温度検出抵抗体5および下流温度検出抵抗体6には差動増幅器17が接続されている。差動増幅器17は、Rsu5とRsd6の両端電圧Vsu,Vsdの電位差を、出力電圧Voutとして端子16から出力する。具体的には、出力電圧Voutは、下記数8に示すように

【数8】

$$Vout = Vsd - Vsu$$

= $R_{s0} \alpha_s (Tsd - Tsu) Is$

となる。数8から明らかなように、出力電圧Voutは、上流温度検出抵抗体5の温度(Tsu)と下流温度検出抵抗体6の温度(Tsd)の差に比例することが理解され

る。

[0026]

出力電圧Voutから、流量を得るためには、一般に、流量-出力電圧のテーブルを予め作成しておき、このテーブルを参照すればよい。テーブルは、流体流量測定装置が有するメモリ(図示せず)に格納される。テーブルを参照する動作は流体流量測定装置の中央演算装置(図示せず)が行う。なお、テーブルを用いることなく、出力電圧Voutを変数として、流量が出力値として与えられる換算式を用いてもよい。

[0027]

図4は、流体の流量に応じた、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の温度変化のグラフである。この図は、熱回路網法によりシミュレーションを行った結果に基づいて作成されている。曲線21、および曲線22は、それぞれ、本実施の形態による上流温度検出抵抗体5の温度、および、下流温度検出抵抗体6の温度を示す。一方、曲線23、24は、それぞれ、従来例における上流温度検出抵抗体5の温度と下流温度検出抵抗体6の温度を示す。従来例では上流温度検出抵抗体5の温度、および、下流温度検出抵抗体6の温度は、流量が大きくなると低下し、その平均温度も流量とともに低下する。数7に関連して説明したように、本実施の形態では、上流側温度検出抵抗体5の温度と下流側温度検出抵抗体6の平均温度を一定に保つよう制御している。したがって、上流側温度検出抵抗体5の温度(曲線21)が流量とともに低下すると、下流側温度検出抵抗体5の温度(曲線21)が流量とともに低下すると、下流側温度検出抵抗体6の温度(曲線22)は流量ともに上昇する。

[0028]

本実施の形態における上流側温度検出抵抗体5の流量による温度低下(曲線21)は、従来例における上流側温度検出抵抗体5の流量による温度低下(曲線23)よりも小さい。このため流量がある程度大きくなった場合には、本発明における上流側温度検出抵抗体5の温度は、従来例における上流側温度検出抵抗体5の温度よりも高くなる。測定可能温度の観点から説明すると、例えば、測定可能温度の下限が65℃と仮定したとき、従来は曲線23で示すように約60g/sの流量までしか測定できなかった。しかし実施の形態1によれば、約200g/

sまで測定可能である。よって実施の形態1における上流側温度検出抵抗体5の 温度は、従来例に比べ、より大流量まで変化が許容される。

[0029]

図5は、上流温度検出抵抗体5の温度と下流温度検出抵抗体6の温度の差の流量依存性を示すグラフである。図中、曲線25は実施の形態1における上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の温度差を示す。一方、曲線26は従来例における上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の温度差を示す。上述のように、実施の形態1における上流側温度検出抵抗体5の温度は、より大流量まで変化が可能であり、また、本発明の下流側温度検出抵抗体6の温度は流量とともに増大する。したがって、その温度差は従来に比べて大きくなり、より大流量まで大きな流量依存性を示す。

[0030]

実施の形態1で説明した上述の構成によれば、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の温度差は従来例に比べより大流量まで大きく変化する。よって、特に大流量において感度が向上し、ダイナミックレンジが拡大できる。また、上流側と下流側の温度検出体5、6の温度をフィードバック制御することになるので、オープンループだった従来に比べ応答性が改善する。

[0031]

(実施の形態2)

実施の形態1では、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の平均温度 を出すために図3に示す加算回路15を用いた。実施の形態2では、異なる回路 を用いて、実施の形態1と同じ結果を得ることができる構成を説明する。

[0032]

図6は、実施の形態2による、抵抗体4、5、6を含む、流体流量測定装置の 回路図である。図6に示すように、上流温度検出抵抗体5の一方の端部は下流温 度検出抵抗体6と直列に接続されており、他方の端部は、定電流Isを供給する定 電流源13に接続されている。このとき上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵 抗体6が直列接続された高電位側の電圧27(Vs)は、下記数9のように、 【数9】

$$Vs = (Rsu + Rsd)Is$$

= $2R_{so}Is + R_{so}\alpha_s(Tsu + Tsd)Is$

となり、実施の形態 I の V add E 同様に E (E su + E sd)に依存した電圧が得られる

[0033]

差動増幅器17は、上流側温度検出抵抗体5の両端電圧と下流側温度検出抵抗体6の両端電圧との差電圧を出力する。

[0034]

このような構成によっても、上流温度検出抵抗体 5 と下流温度検出抵抗体 6 の 温度差は従来例に比べより大流量まで大きく変化するので、特に大流量において 感度が向上し、ダイナミックレンジが拡大できる。

[0035]

実施の形態1、2の回路構成では、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6に定電流を供給する定電流源13を用いた。しかし、定電圧を印加する定電圧源を用いても同様の結果が得られる。また、上流側と下流側の温度検出体5、6の温度をフィードバック制御することになるので、オープンループだった従来に比べ応答性が改善する。

[0036]

(実施の形態3)

図7は、実施の形態3の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。流体流量測定装置は、シリコン基板1上に形成された薄肉部3に、中央発熱抵抗体4、上流側温度検出抵抗体5、下流側温度検出抵抗体6、および、上流側発熱抵抗体28、下流側発熱抵抗体29を備えている。上流側発熱抵抗体28は、中央発熱抵抗体4と上流側温度検出抵抗体5の間(近傍)に、下流側発熱体29は、中央発熱抵抗体4と下流側温度検出抵抗体6の間(近傍)に配置されている。その他の構成は図1および図2と同様である。

[0037]

実施の形態3では、中央発熱抵抗体4、上流側温度検出抵抗体5、下流側温度

検出抵抗体6を用いて図3と同様の回路を構成し、上流側温度検出抵抗体5と下流側温度検出抵抗体6の平均温度を一定に保つように中央発熱抵抗体4に供給する電力を制御する。

[0038]

図8は、実施の形態3による、抵抗体5、6、28、29を含む流体流量測定装置の回路図である。上流側温度検出抵抗体5(Rsu)と下流側温度検出抵抗体6(Rsd)には定電流を供給する定電流源13が接続されている。図8に示すように、上流側温度検出抵抗体5の両端電圧(Vsu)と下流側温度検出抵抗体6の両端電圧(Vsd)とは、それぞれコンパレータ30の一入力端子と+入力端子とに入力される。コンパレータ30の出力は、上流側温度検出抵抗体5の温度が下流側温度検出抵抗体6の温度より低い場合(すなわちVsu〈Vsdの場合)にはハイレベルとなり、逆の場合(すなわちVsu〉Vsdの場合)にはローレベルとなる。コンパレータ30の出力はスイッチ31、32に接続される。スイッチ31は上流側発熱抵抗体28と電源11との接続を制御し、スイッチ32は下流側発熱抵抗体29と電源11との接続を制御する。

[0039]

次に図8の回路の動作を説明する。上流側から流体の流れが生じた場合、上流側温度検出抵抗体5の温度は下流側温度検出抵抗体6の温度より低くなり、それぞれの両端電圧の関係はVsu〈Vsdとなる。このときコンパレータ30の出力はハイレベルになるので、スイッチ31がオンされ、スイッチ32がオフされる。そして上流側発熱抵抗体28が電源11に接続される。上流側発熱抵抗体28に電流が流れるとジュール熱により発熱し、近傍にある上流側温度検出抵抗体5の温度を上昇させる。上流側温度検出抵抗体5の温度が上昇して、下流側温度検出抵抗体5の温度を上昇させる。と流側温度検出抵抗体5の高度が上昇して、下流側温度検出抵抗体6の温度より高くなると、それぞれの両端電圧の関係はVsu〉Vsdとなる。このときコンパレータ30の出力はローレベルとなり、スイッチ31はオフされ、スイッチ32はオンされて、下流側発熱抵抗体29と電源11とが接続される。下流側発熱抵抗体29に電流が流れるとジュール熱により発熱し、近傍にある下流側温度検出抵抗体6の温度を上昇させる。下流側温度検出抵抗体6の温度が上昇して、上流側温度検出抵抗体5の温度より高くなると、それぞれの両端電圧

の関係はVsu<Vsdとなり、初期の状態に戻る。このようにスイッチ31、32の働きにより、電源11を上流側発熱抵抗体28と下流側発熱抵抗体29に交互に切り換える動作が繰り返され、上流側温度検出抵抗体5の温度と下流側温度検出抵抗体6の温度が等しくなるように制御される。

[0040]

図9は、抵抗体28(図8)および抵抗体29(図8)の端子電圧と、出力端子16(図8)の電圧との関係を示す図である。図中、パルス36は、上流側発熱抵抗体28(図8)の+側端子34の電圧を示す。パルス37は下流側発熱抵抗体29(図8)の+側端子35の電圧を示す。パルス38は出力端子16(図8)の電圧を示す。上流側から流体が流れている場合、上流側温度検出抵抗体5(図8)の温度と、下流側温度検出抵抗体6(図8)の温度とを等しくするためには、上流側発熱抵抗体28(図8)により多くの電力を供給しなければならない。したがって、スイッチ31(図8)が閉じている時間t1の方がスイッチ32(図8)が閉じている時間t2より長くなる。この差(または比)は流体の流量が大きいほど大きくなる。逆流の場合は大小関係が逆になる。図10に示すように、出力電圧38からアナログ電圧を得る際の処理を示す図である。図10に示すように、出力電圧38をローパスフィルタ41に通すことにより、アナログ電圧出力42)が得られる。電圧42は出力電圧38のデューティ比[t1/(t1+T2)]に応じた値となる。よって電圧42を測定することにより、流体の流量を知ることができる。

[0041]

図11は、実施の形態3の構成による流量とデューティ比との関係を示すグラフ39である。デューティ比は、流量0の時は50%で、流量の増大とともに増大する。デューティ比が100%になる流量は、上下流発熱抵抗体と上下流温度検出抵抗体の位置関係や電源電圧によって調整できる。図10に示す出力回路を用いた場合、図11と同様の出力カーブが得られる。

[0042]

図3に示す回路により、上流側温度検出抵抗体5(図3)と下流側温度検出抵抗体6(図3)の平均温度を一定に保ち、しかも図8に示す回路により両者の温度を等しく制御することにより、抵抗体5、6の温度は全流量範囲において一定

に保たれることになる。

[0043]

以上のように、実施の形態3では上流側温度検出抵抗体5と下流側温度検出抵抗体6の温度が流量によらず一定に保たれるので、ダイナミックレンジが拡大する。また、流量変化による温度変化が生じないので応答性が向上する。さらに、抵抗体の温度を100℃以上に保つことができるので、水滴などが付着した場合に即座に蒸発させることができ、水分付着による特性のドリフトを低減することができる。

[0044]

(実施の形態4)

図12は、図10で説明した出力電圧Vout をデジタル出力するための処理を示す図である。出力電圧38と高周波パルス信号43とを乗算器44によって乗算すると、出力電圧38がハイレベルにあるときだけ(図9のt1の間だけ)高周波パルス45が残る。この高周波パルス45のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ46で計数することにより、デジタル出力47が得られる。

[0045]

このような構成により出力電圧をデジタル化することにより、実施の形態3と同様の効果が得られる上に、コンピュータを利用する際の、中央処理装置(以下、「CPU」という)との結合性が良くなる。

[0046]

(実施の形態5)

実施の形態3では、デューティ比[t1/(t1+t2)]を出力として採用したが、デューティ比差[(t1-t2)/(t1+t2)]を出力とすることもできる。図13は、デューティ比差を出力するための処理を示す図である。まず上流側発熱抵抗体28(図8)の+側の端子34の電圧48(Vhu)と、下流側発熱抵抗体29(図8)の+側の端子35の電圧49(Vhd)とを、それぞれローパスフィルタ41に通すことにより、アナログ電圧を得る。得られたアナログ電圧を減算回路50で減算処理することにより、デューティ比差[(t1-t2)/(t1+t2)]に応じたアナログ電圧51が得られる。図14は、実施の形態5の構成による流量とデューティ比差との

関係を示すグラフ40である。実施の形態5のデューティ比差[(t1-t2)/(t1+t2)]は、図14の曲線40で示す流量依存性を有するので、図13の出力処理で得られる出力電圧51も曲線40と同様の流量依存性を有する。

[0047]

このような構成によっても実施の形態3と同様の効果が得られるとともに、オフセット出力(流量0での出力)が0にできるので感度がさらに向上する。

[0048]

(実施の形態6)

図15は、上流側発熱抵抗体28(図8)の+側の端子34の電圧48(Vhu)と、下流側発熱抵抗体29(図8)の+側の端子35の電圧49(Vhd)とを、デジタル出力するための処理を示す図である。乗算器44において、電圧48と49のそれぞれに高周波パルス信号43を乗算すると、電圧波形48、49がハイレベルにあるときだけ高周波パルス53、54が残る。このパルス53、54のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ46で計数し、減算器50で減算処理することによりデジタル出力47が得られる。

[0049]

このような構成にすることにより、実施の形態 5 と同様の効果が得られる上に 、C P U との結合性が良くなる。

[0050]

実施の形態3、4、5、6の回路構成では、上流温度検出抵抗体5および下流 温度検出抵抗体6には、定電流を供給する定電流源13を用いた。しかし、定電 圧を印加する定電圧源を用いても同様の結果が得られる。

[0051]

(実施の形態7)

図16は、実施の形態7の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。 実施の形態7の流体流量測定装置では、シリコンチップ1上に流体の温度を検出 する流体温度検出抵抗体55が形成されている。流体温度検出抵抗体55は、発 熱抵抗体4から熱的な影響を受けないように薄肉部3から離れた位置に形成され る。流体温度検出抵抗体55の裏面のシリコンをエッチングにより除去し、流体 温度検出抵抗体55を第2の薄肉部上に形成してもよい。

[0052]

図17は、実施の形態7による、流体温度検出抵抗体55を含む、流体流量測定装置の回路図である。この回路において、電圧19 (Vt) は数10で表される

【数10】

$$Vt = \frac{R_2}{Ra + R_1 + R_2} Vc$$

[0053]

数1のVaddと、数10のVtとが等しくなるように制御すると、下記数11が成り立つ。

【数11】

$$G(Vsu + Vsd) = Ve - \frac{R_2}{Ra + R_1 + R_2}Vc$$

[0054]

流体温度検出抵抗体 5 5 の 0 ℃ の時の抵抗値を R a 0、抵抗温度係数 を α a と すると、流体温度(および抵抗体 5 5) の温度が T a の と き、

【数12】

$$Ra = R_{a0} (1 + \alpha_{as} Ta)$$

数11、および数6から

【数13】

$$\frac{1}{2}(Tsu + Tsd) = \left[Ve - \frac{R2}{R_{a0}(1 + \alpha_a Ta) + R1 + R2}Vc - 2GR_{s0}Is\right] / 2G\alpha_sIs$$

が成り立つ。数13の右辺に流体温度検出抵抗体55の温度Taが含まれているため、右辺全体はTaに依存した値となる。よって、上流側温度検出抵抗体5の温度(Tsu)と下流側温度検出抵抗体6の温度(Tsd)の平均値も流体温度Taに依存した値となり、流体温度Taが高いときは上流側温度検出抵抗体5と下流側温度検出抵抗体6の平均温度も高く、流体温度Taが低いときは上流側温度検出抵抗体5と下流側温度検出抵抗体6の平均温度も低くなる。流体温度Taと、

上流側温度検出抵抗体5および下流側温度検出抵抗体6の平均温度との関係は、数13中の回路定数R1やR2により調整できる。

[0055]

このような構成および制御を採用することにより、流体の温度が変化したとき の特性の変化を補償することができ、温度特性が向上する。

[0056]

(実施の形態8)

実施の形態7では、電圧19 (Vt)が流体温度によって変化するよう、流体温度検出抵抗体55 (Ra)を抵抗R1、R2と直列に接続した。しかし、数13から理解されるように、電圧Veを流体温度によって変化させても同様の効果が得られる。例えば図18のような構成を採用することもできる。

[0057]

図18は、実施の形態8における、電圧Veを出力する回路図である。この回路では、固定抵抗(R3,R4)および流体温度検出抵抗体55により定電圧源56を分圧した電圧を電圧Veとして出力する。流体温度の変化は、流体温度検出抵抗体55を用いて検出されるので、流体温度が変化したときにVeを変化させることができる。よって、上流側温度検出抵抗体5(図17)の温度(Tsu)と下流側温度検出抵抗体6(図17)の温度(Tsd)の平均値も、流体温度Taにより変化させることができる。流体温度Taと上流側温度検出抵抗体5、下流側温度検出抵抗体6の平均温度との関係は、図18中の固定抵抗R3やR4により調整すればよい。

[0058]

上述の公正によれば、流体の温度が変化したときの特性の変化を補償することができ、温度特性が向上する。

[0059]

(実施の形態9)

実施の形態 8 で説明したように、流体温度検出抵抗体を用いれば、流体温度の 変化を反映した特性の変化を保証できる。

[0060]

図19は、実施の形態9における、流体温度検出抵抗体55を挿入した流体流 量測定装置の回路図である。

[0061]

さらに言うまでもなく、実施の形態3、4、5、6においても、図17、18、19に示す回路の構成を採用することにより、流体の温度が変化したときの特性の変化を補償することができ、温度特性が向上する。

[0062]

(実施の形態10)

【数14】

 $\Delta Ts = k(Q) \times \Delta Th$

[0063]

ここで k(Q) は流量に依存する係数である。数14 から理解されるように、 Δ Thを変化させることにより、抵抗体 5 と 6 の温度差 Δ Tsを変化させることができる。

[0064]

実施の形態10では、抵抗体4と流体の温度差 Δ Thを流量に応じて変化させる。図21は、流量によって変化させた温度差 Δ Thを示すグラフ57を示す。温度差 Δ Thをこのように変化させることにより、 Δ Tsを線形にすることができる。図22は、図21に示す抵抗体4と流体の温度差 Δ Thに基づいて得られた、抵抗体5と6の温度差 Δ Tsを示す線形のグラフ58である。数8によれば、出力電圧Voutは Δ Tsに比例することから、 Δ Tsが線形であれば、流量に対し

て線形な出力電圧Voutが得られる。

[0065]

出力電圧が流量に対して線形になると、脈動流特性が改善されることを図23、図24において説明する。図23、および、図24は、脈動流特性の説明図である。脈動流特性とは、流体の流量がある周波数で変動している場合にいかに正確に流量測定を行えるかという特性である。自動車のエンジンに吸入される空気の管路内では、高負荷域において、脈動流が実際に発生する場合がある。図23を参照して、まず従来の場合(出力電圧が非線形の場合)を説明する。曲線59は、流量と出力電圧の関係を示す。このとき、曲線60で示すような、流量が時間的に変動する脈動流を電圧変換すると、曲線61で示す波形が得られる。自動車用のエンジン制御の場合、ある時間間隔の平均値を出力として用いる。そこで曲線61の平均値を計算すると、一点鎖線62で示す電圧レベルとなる。ところが、これを曲線59を用いて流量変換すると一点鎖線63で示す流量になるが、これは脈動流60の平均流量64と一致しない。上述のように、非線形の流量一出力関係を用いて脈動流を電圧変換し、その平均電圧を再度流量変換するような信号処理をすると、実際の平均流量とは異なる流量値が計算される。この差が脈動流誤差として現れる。

[0066]

図24の曲線65で示すように、流量と出力電圧の関係が線形である場合は、 脈動流量60を電圧変化すると66で示すような波形となり、その平均電圧を流 量換算した値67と脈動流量60の平均値64とは一致する。このため脈動流誤 差は発生しない。

[0067]

本実施の形態では、流量と出力電圧の関係が線形となるように発熱抵抗体4の 温度を流量によって変化させたので脈動特性が改善される。なお、本実施の形態 の内容は、実施の形態2に対しても適用できる。これにより、上述した本実施の 形態の効果と同じ効果が得られる。

[0068]

(実施の形態11)

図25は、実施の形態11の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。流体流量測定装置は、シリコン基板1上に形成された薄肉部3に、上流側から上流側温度検出抵抗体5、第1の発熱抵抗体68、第2の発熱抵抗体69、第3の発熱抵抗体70、第4の発熱抵抗体71、下流側温度検出抵抗体6の6つの抵抗体を備えている。なお、「温度検出抵抗体」、および、「発熱抵抗体」と区別しているが、これらは、「感温抵抗体」と呼ばれる同一の要素と考えることができる。すなわち、感温抵抗体は、温度を検出する機能と、熱を発する機能の2つの機能を有する。

[0069]

図26は、実施の形態11による、6つの抵抗体を含む、流体流量測定装置の回路図である。上流側温度検出抵抗体5 (Rsu)と下流側温度検出抵抗体6 (Rsd)には定電流源13が接続され、定電流Isが供給される。上流側温度検出抵抗体5の両端電圧 (Vsu)と下流側温度検出抵抗体6の両端電圧 (Vsd)とは、それぞれコンパレータ72の一入力端子と十入力端子とに入力される。コンパレータ72の出力は、上流側温度検出抵抗体5の温度が下流側温度検出抵抗体6の温度より低い場合(すなわちVsu<Vsdの場合)にはハイレベルとなり、逆の場合(すなわちVsu>Vsdの場合)にはハイレベルとなり、逆の場合(すなわちVsu>Vsdの場合)にはローレベルとなる。コンパレータ72の出力はスイッチ74、75に接続される。

[0070]

第1の発熱抵抗体68と第4の発熱抵抗体71には、定電流Isを供給する定電流源80が接続されている。第1の発熱抵抗体68の両端電圧82 (Vh1)と、第4の発熱抵抗体71の両端電圧85 (Vh4)は、それぞれコンパレータ73の一入力端子と+入力端子に入力される。コンパレータ73の出力は、第1の発熱抵抗体68の温度が第4の発熱抵抗体71の温度より低い場合 (すなわちVh1<Vh4の場合)はハイレベルとなり、逆の場合 (すなわちVh1>Vh4の場合)はローレベルとなる。コンパレータ73の出力はスイッチ76,77,78,79に接続されている。スイッチ74の一端は電源11に接続され、他端はスイッチ78の一端、および、スイッチ79の一端に接続されている。スイッチ78の他端は、第2の発熱抵抗体69に接続され、スイッチ79の他端は第1の発熱抵抗体68に接続

されている。また、スイッチ75の一端は電源11に接続され、他端はスイッチ76の一端、および、スイッチ77の一端に接続されている。スイッチ76の他端は第4の発熱抵抗体71に接続され、スイッチ77の他端は第3の発熱抵抗体70に接続されている。コンパレータ72の出力端16とコンパレータ73の出力端81の電圧が出力電圧となる。

[0071]

次に図26の回路の動作を説明する。上流側から流体の流れが生じた場合、上流側温度検出抵抗体5の温度は下流側温度検出抵抗体6の温度より低くなり、それぞれの両端電圧の関係はVsu<Vsdとなる。このときコンパレータ72の出力はハイレベルになるので、スイッチ74がオンされ、スイッチ75がオフされる。またこのとき、第1の発熱抵抗体68の温度は第4の発熱抵抗体71の温度よりも低くなり、それぞれの両端電圧の関係はVh1<Vh4となる。よってコンパレータ73の出力はハイレベルとなり、スイッチ76とスイッチ78がオンされ、スイッチ77とスイッチ79はオフされる。すると第2の発熱抵抗体69が電源11に接続される。

[0072]

第2の発熱抵抗体69に電流が流れるとジュール熱により発熱し、近傍にある第1の発熱抵抗体68の温度を上昇させる。第1の発熱抵抗体68の温度が上昇して、第4の発熱抵抗体71の温度より高くなると、それぞれの両端電圧の関係はVh1>Vh4となる。このときコンパレータ73の出力はローレベルとなり、スイッチ76、78はオフされ、スイッチ77、79はオンされて、第1の発熱抵抗体68と電源11とが接続される。

[0073]

第1の発熱抵抗体68に電流が流れるとジュール熱により発熱し、近傍にある上流側温度検出抵抗体5の温度を上昇させる。上流側温度検出抵抗体5の温度が上昇して、下流側温度検出抵抗体6の温度より高くなると、それぞれの両端電圧の関係はVsu>Vsdとなる。その結果、コンパレータ72の出力がローレベルとなり、スイッチ74はオフされ、スイッチ75はオンされる。すると、第3の発熱抵抗体70と電源11とが接続され、第3の発熱抵抗体70に電流が流れる。

[0074]

第3の発熱抵抗体70はジュール熱により発熱し、近傍にある第4の発熱抵抗体71の温度を上昇させる。第4の発熱抵抗体71の温度が上昇して、第1の発熱抵抗体68の温度より高くなると、それぞれの両端電圧の関係はVh1<Vh4となる。このときコンパレータ73の出力はハイレベルとなり、スイッチ77、79はオフされ、スイッチ76、78はオンされる。すると第4の発熱抵抗体71と電源11が接続され、第4の発熱抵抗体71に電流が流れる。

[0075]

第4の発熱抵抗体71はジュール熱により発熱し、近傍にある下流側温度検出抵抗体6の温度を上昇させる。下流側温度検出抵抗体6の温度が上昇し、上流側温度検出抵抗体5の温度より高くなると、それぞれの両端電圧の関係はVsu<Vsdとなる。このときコンパレータ72の出力はハイレベルとなり、スイッチ75はオフされ、スイッチ74はオンされて、初期の状態に戻る。

[0076]

このように、スイッチ74、75、76、77、78、79によって、電源1 1を第1、第2、第3、第4の発熱抵抗体に順番に切り換える動作が繰り返され 、上流側温度検出抵抗体5の温度と下流側温度検出抵抗体6の温度、および、第 1の発熱抵抗体68の温度と第4の発熱抵抗体71の温度が等しくなるように制 御される。

[0077]

図27は、抵抗体68~71(図26)の端子電圧と、出力端子16、81(図26)の電圧との関係を示す図である。図中、パルス86は、図26における第1の出力電圧16(Vout1)を示す。パルス87は、第2の出力電圧81(Vout2)を示す。また、パルス88は第2の発熱抵抗体69の両端電圧(Vh2)、パルス89は第1の発熱抵抗体68の両端電圧(Vh1)、パルス90は第3の発熱抵抗体70の両端電圧(Vh3)、パルス91は第4の発熱抵抗体71の両端電圧(Vh4)を示す。図27に示すタイミングから明らかなように、パルス86(Vout1)およびパルス87(Vout2)の両方がハイレベルのとき、パルス88(Vh2)がハイレベルになる。そして、その後、Vh1、Vh3、Vh4の順にハイレベル状態が移動し、

再度Vh2に戻る。図28は、Vout1,Vout2とVh1~Vh4との関係を示す図である。

上流側から流体が流れている場合、上流側温度検出抵抗体5の温度が下流側温度検出抵抗体6の温度より低い時間の方が長いため、コンパレータ72の出力がハイレベルにある時間(t1)の方がローレベルにある時間(t2)より長くなる。また、第1の発熱抵抗体68の温度が第4の発熱抵抗体71の温度より低い時間の方が長いためコンパレータ73の出力がハイレベルにある時間(t3)の方がローレベルにある時間(t4)より長くなる。それぞれの差(あるいは比)は流体の流量が大きいほど大きくなる。逆流の場合は大小関係が逆になる。

[0078]

図29に示すように、出力電圧86 (Vout1)、87 (Vout2)をローパスフィルタ92、93に通すことにより、アナログ出力電圧94、95が得られる。アナログ出力電圧94、95は、出力電圧86、87のデューティ比[t1/(t1+T2)]、および、[t3/(t3+t4)]に応じた値をとる。アナログ出力電圧94、95を加算回路96によって加算することにより最終的な出力電圧97が得られる。よって電圧97を測定することにより、流体の流量を知ることができる。

[0079]

図30は、2つの出力電圧94、95から得られた最終的な出力電圧97のグラフを示す図である。上流側温度検出抵抗体5および下流側温度検出抵抗体6の温度の大小関係に基づいて得られた出力電圧94 (Vout1)は、第1の発熱抵抗体68と第4の発熱抵抗体71の温度の大小関係に基づいて得られた出力電圧95 (Vout2)よりも、より小流量域で変化が大きくなる。逆に大流量域では、出力電圧94 (Vout1)が飽和状態になるのに対し、出力電圧95 (Vout2)は変化が大きくなる。これは上流側温度検出抵抗体5と下流側温度検出抵抗体6が薄肉部3上の高温部(中央部)から離れた位置にあり、小流量で温度変化がおきやすいためであり、さらに、第1、第4の発熱抵抗体68、71は高温部により近く、大流量で温度変化が起きやすくなるためである。2つの出力電圧を加算することにより、小流量でも大流量でも感度の高い出力電圧97が得られる。比較のため、従来の出力電圧98を点線で示す。

[0080]

以上のように、本実施の形態では小流量域で感度の良い出力と大流量域で感度の良い出力を加算して出力とするので、広範囲において感度の良い出力が得られ、ダイナミックレンジが拡大する。また、上流側温度検出抵抗体 5、下流側温度検出抵抗体 6、第1の発熱抵抗体 6 8、第4の発熱抵抗体 71の温度をフィードバック制御することになるので、オープンループだった従来に比べ応答性が向上する。

[0081]

(実施の形態12)

図31は、図29で説明した出力電圧86(Vout1)および87(Vout2)をデジタル出力するための処理を示す図である。出力電圧86、87と高周波パルス信号99を乗算器100、101によって乗算すると、出力電圧86、87がハイレベルにあるときだけ(図27のt1、t3の間だけ)高周波パルス102、103が残る。これら高周波パルス102、103のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ104、105で計数し、その結果を加算回路106で加算することにより、デジタル出力107が得られる。

[0082]

このような構成にすることにより、実施の形態11と同様の効果が得られる上に、CPUとの結合性が良くなる。

[0083]

(実施の形態13)

実施の形態 1 1 では、デューティ比 [t1/(t1+t2)]、 [t3/(t3+t4)] を出力として採用したが、デューティ比差 [(t1-t2)/(t1+t2)]、 [(t3-t4)/(t3+t4)] を出力とすることもできる。

[0084]

図32は、デューティ比差を出力するための処理を示す図である。まず、出力電圧86(Vout1)は、ローパスフィルタ92に通され、アナログ電圧94が得られる。また、出力電圧86(Vout1)は、反転回路108で反転され、さらにローパスフィルタ110に通され、アナログ電圧112が得られる。これらのアナログ電圧94、112を減算回路114で減算処理することにより、デューティ比

差 [(t1-t2)/(t1+t2)] に応じたアナログ電圧 1 1 6 が得られる。

[0085]

一方、出力電圧 8 7 (Vout2)は、ローパスフィルタ 9 3 に通され、アナログ電 圧 9 5 が得られる。また、出力電圧 8 7 (Vout2)は、反転回路 1 0 9 で反転され、さらにローパスフィルタ 1 1 1 に通され、アナログ電圧 1 1 3 が得られる。これらのアナログ電圧 9 5、 1 1 3 を減算回路 1 1 5 で減算処理することにより、デューティ比差 [(t3-t4)/(t3+t4)] に応じたアナログ電圧 1 1 7 が得られる。

[0086]

以上のようにして得られたアナログ電圧116、117を、加算回路96で加算することにより最終出力電圧97が得られる。

[0087]

このような構成によっても実施の形態 1 1 と同様の効果が得られるとともに、 オフセット出力(流量 0 での出力)が 0 にできるので感度がさらに向上する。

[0088]

(実施の形態14)

図33は、図29で説明した出力電圧86(Vout1)および87(Vout2)をデジタル出力するための別の処理を示す図である。

[0089]

まず乗算器100において、出力電圧86(Vout1)に高周波パルス信号99を乗算すると、出力電圧86がハイレベルにあるときだけ高周波パルス102が残る。このパルス102のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ104で計数する。また、出力電圧86(Vout1)を反転回路118で反転し、乗算器120において、高周波パルス信号99を乗算すると、反転電圧がハイレベルにあるときだけ高周波パルス122が残る。このパルス122のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ124で計数する。以上のようにして得られたパルスの計数結果を、減算回路126で減算処理する。

[0090]

一方、乗算器101において、出力電圧87(Vout2)に高周波パルス信号99 を乗算すると、出力電圧87がハイレベルにあるときだけ高周波パルス103が 残る。このパルス103のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ105で計数する。また、出力電圧87(Vout2)を反転回路119で反転し、乗算器121において、高周波パルス信号99を乗算すると、反転電圧がハイレベルにあるときだけ高周波パルス123が残る。このパルス123のパルス数を、一定時間、パルスカウンタ125で計数する。以上のようにして得られたパルスの計数結果を、減算回路127で減算処理する。

[0091]

以上のようにして求めたそれぞれの減算結果を、加算回路106において加算 することにより、最終的なデジタル出力107が得られる。

[0092]

このような構成にすることによっても、実施の形態13と同様の効果が得られる上に、CPUとの結合性が良くなる。

[0093]

実施の形態11、12、13、14の回路構成では、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6、第1の発熱抵抗体68、および、第4の発熱抵抗体71には、定電流を供給する定電流源13、80を用いた。しかし、定電圧を印加する定電圧源を用いても同様の結果が得られる。

[0094]

(実施の形態15)

図34は、実施の形態15の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である

実施の形態 1 5 の流体流量測定装置では、第 2 の発熱抵抗体 6 9 と第 3 の発熱抵抗体 7 0 との間に中央発熱抵抗体 4 を形成した。図では、配線部 9 とパッド部 1 0 は図 2 5 と同様であるので、それらの記載は省略している。中央発熱抵抗体 4 (Rh)、上流側温度検出抵抗体 5 (Rsu)、および、下流側温度検出抵抗体 6 (Rsd) により定温度回路を構成し、上流側温度検出抵抗体 5 と下流側温度検出抵抗体 6 の平均温度が一定となるように中央発熱抵抗体 4 に供給する電力を制御する。定温度回路図は図 3 と同一である。

[0095]

図3の回路によれば、上流側温度検出抵抗体5および下流側温度検出抵抗体6 の平均温度を一定に保つことができる。さらに図26の回路により、上流側温度 検出抵抗体5および下流側温度検出抵抗体6の温度を等しく制御することにより 、抵抗体5、6の温度は全流量範囲において一定に保たれることになる。

[0096]

以上のように、本実施の形態の構成によれば、上流側温度検出抵抗体 5 と下流側温度検出抵抗体 6 の温度が流量によらず一定に保たれるので、ダイナミックレンジの拡大が図れる。また、流量変化による温度変化が生じないので応答性が向上する。さらに、抵抗体の温度を100℃以上に保つことができるので、水滴などが付着した場合に即座に蒸発させることができ、水分付着による特性のドリフトを低減することができる。

[0097]

(実施の形態16)

図35は、実施の形態16の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。図では、配線部9とパッド部10は図25と同様であるので、それらの記載は省略している。

[0098]

実施の形態 1 6 では、シリコンチップ 1 上に流体の温度を検出する流体温度検 出抵抗体 5 5 (Ra)を形成する。流体温度検出抵抗体 5 5 は発熱抵抗体 4 、 6 8 、 6 9 、7 0 、7 1 から熱的な影響を受けないように薄肉部 3 から離れた位置に形 成される。流体温度検出抵抗体 5 5 の裏面のシリコンをエッチングにより除去し 、流体温度検出抵抗体 5 5 を第 2 の薄肉部上に形成してもよい。

[0099]

流体温度検出抵抗体55を用いて図17に示す回路を構成する。これにより、 実施の形態7と同様に、上流側温度検出抵抗体5の温度(Tsu)と下流側温度検 出抵抗体6の温度(Tsd)との平均値が流体温度Taに依存した値となり、流体 温度Taが高いときは上流側温度検出抵抗体5および下流側温度検出抵抗体6の 平均温度も高い。一方、流体温度Taが低いときは上流側温度検出抵抗体5と下 流側温度検出抵抗体6の平均温度も低くなるように制御される。流体温度Taと

上流側温度検出抵抗体 5、下流側温度検出抵抗体 6 の平均温度との関係は、数 1 3 中の回路定数 R 1 や R 2 により調整できる。

[0100]

このような構成および制御を採用することにより、流体の温度が変化したとき の特性の変化を補償することができ、温度特性が向上する。

[0101]

【発明の効果】

2つの検出体(センサ)が検出した温度の平均値が所定の値になるよう、制御回路が発熱体に供給する電力を制御するので、流量が増大しても、上流側、及び、下流側温度検出体の温度を高く保つことができる。よって、特に大流量での感度増大、ダイナミックレンジの拡大に効果がある。また、上流側と下流側の温度検出体の温度をフィードバック制御することになるので、オープンループだった従来に比べ応答性が改善する。

[0102]

流体の流量が増大しても、上流側と下流側の温度検出体(センサ)の温度を、 等しく一定に保つので、応答性が改善する。さらに、上流発熱体および下流発熱 体を設けることにより、上流側と下流側のセンサの温度を高く保つことができる ので、特に大流量での感度が増大し、ダイナミックレンジも拡大する。

[0103]

流体の温度が変化しても流体と装置との温度差を一定に保つので、流体の温度 変化が生じた場合でも流量を測定することができる。また、出力信号を流量に対 して線形にすることができ、脈動時の誤差を低減することができる。

[0104]

流体の上流側から下流側に設けた6つの感温抵抗体のうち、第2、第5の感温 抵抗体に供給される電力差は流体流量が小さいときに変化が大きく、第3、第4 の感温抵抗体に供給される電力差は流体流量が大きいときに変化が大きくなる。 よって、広い流量範囲にわたって感度の良い流量測定が可能となる。また、上流 側と下流側の感温抵抗体の温度をフィードバック制御することになるので応答性 が改善する。 [0105]

流量が増大しても、第1~第6の感温抵抗体の温度を高く保つことができるので、特に大流量での感度増大、ダイナミックレンジの拡大に効果がある。また、 上流側と下流側の温度検出体の温度を一定に保つことになるので応答性が改善する。

[0106]

流体の温度が変化しても流体と装置との温度差が一定に保たれるので、流体の 温度変化が生じた場合でも流量を測定できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 実施の形態1の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である
- 【図2】 薄肉部3の断面図である。
- 【図3】 実施の形態1による、抵抗体4、5、6を含む、流体流量測定装置の回路図である。
- 【図4】 流体の流量に応じた、上流温度検出抵抗体5と下流温度検出抵抗体6の温度変化のグラフである。
- 【図5】 上流温度検出抵抗体5の温度と下流温度検出抵抗体6の温度の差の流量依存性を示すグラフである。
- 【図6】 実施の形態2による、抵抗体4、5、6を含む、流体流量測定装置の回路図である。
 - 【図7】 実施の形態3の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である
- 【図8】 実施の形態3による、抵抗体5、6、28、29を含む流体流量 測定装置の回路図である。
- 【図9】 抵抗体28(図8)および抵抗体29(図8)の端子電圧と、出力端子16(図8)の電圧との関係を示す図である。
 - 【図10】 出力電圧38からアナログ電圧を得る際の処理を示す図である
 - 【図11】 実施の形態3の構成による流量とデューティ比との関係を示す

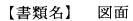
グラフ39である。

- 【図12】 図10で説明した出力電圧Vout をデジタル出力するための処理を示す図である。
 - 【図13】 デューティ比差を出力するための処理を示す図である。
- 【図14】 実施の形態5の構成による流量とデューティ比差との関係を示すグラフ40である。
- 【図15】 上流側発熱抵抗体28(図8)の+側の端子34の電圧48(Vhu)と、下流側発熱抵抗体29(図8)の+側の端子35の電圧49(Vhd)とを、デジタル出力するための処理を示す図である。
- 【図16】 実施の形態7の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。
- 【図17】 実施の形態7による、流体温度検出抵抗体55を含む、流体流量測定装置の回路図である。
 - 【図18】 実施の形態8における、電圧Veを出力する回路図である。
- 【図19】 実施の形態9における、流体温度検出抵抗体55を挿入した流体流量測定装置の回路図である。
 - 【図20】 流体の流量と温度差△Thとの関係を示すグラフである。
 - 【図21】 流量によって変化させた温度差 Δ Thを示すグラフ57を示す
- 【図22】 図21に示す抵抗体4と流体の温度差 Δ Thに基づいて得られた、抵抗体5と6の温度差 Δ Tsを示す線形のグラフ58である。
 - 【図23】 脈動流特性の説明図である。
 - 【図24】 脈動流特性の説明図である。
- 【図25】 実施の形態11の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。
- 【図26】 実施の形態11による、6つの抵抗体を含む、流体流量測定装置の回路図である。
- 【図27】 抵抗体68~71(図26)の端子電圧と、出力端子16、8 1(図26)の電圧との関係を示す図である。

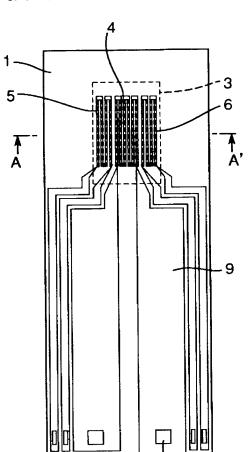
- 【図28】 Vout1, Vout2とVh1~Vh4との関係を示す図である。
- 【図29】 最終出力を出力するための処理を示す図である。
- 【図30】 2つの出力電圧94、95から得られた最終的な出力電圧97 のグラフを示す図である。
- 【図31】 図29で説明した出力電圧86(Vout1)および87(Vout2)を デジタル出力するための処理を示す図である。
 - 【図32】 デューティ比差を出力するための処理を示す図である。
- 【図33】 図29で説明した出力電圧86(Vout1)および87(Vout2)を デジタル出力するための別の処理を示す図である。
- 【図34】 実施の形態15の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。
- 【図35】 実施の形態16の流体流量測定装置の測定部の構成を示す図である。

【符号の説明】

1 シリコン基板、 2 空洞部、 3 薄肉部、 4 発熱抵抗体、 5 上流側温度検出抵抗体、 6 下流側温度検出抵抗体、 7 絶縁層、 8 絶 縁層、 9 配線部、 10 パッド部、 13 定電流源、 15 加算回路 、 17 差動増幅器



【図1】



1:シリコンチップ

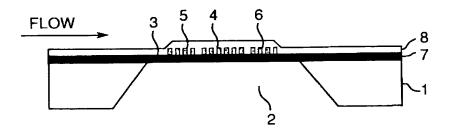
2:空洞部 3:薄肉部

4:発熱抵抗体

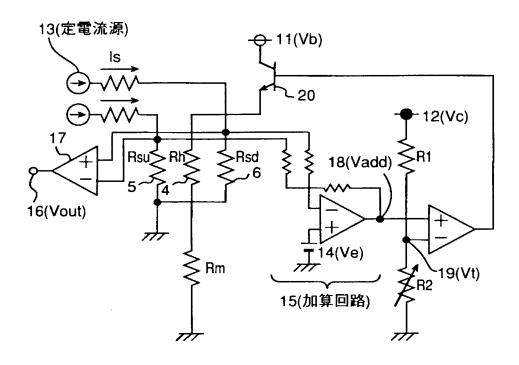
5:上流側温度検出抵抗体 6:下流側温度検出抵抗体

7:絶縁層 8:絶縁層 9:配線部 10:パッド部

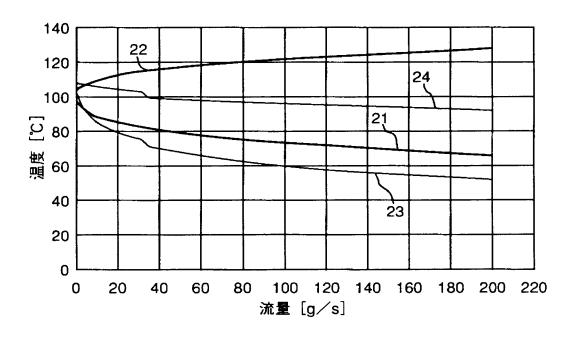
【図2】



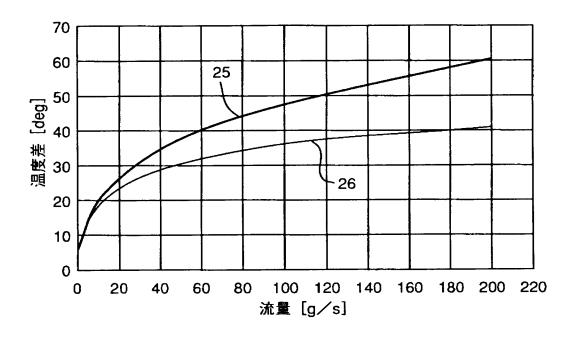
【図3】



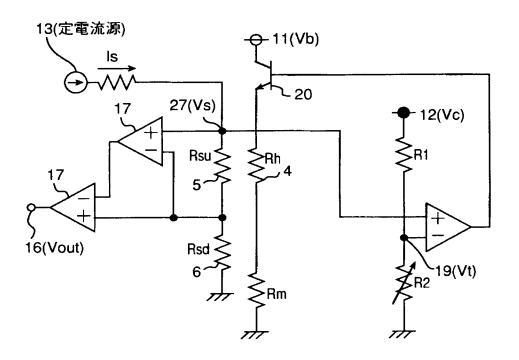
【図4】



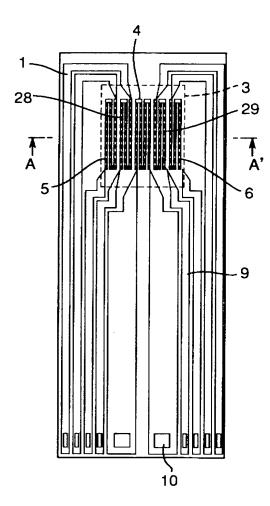
【図5】



【図6】

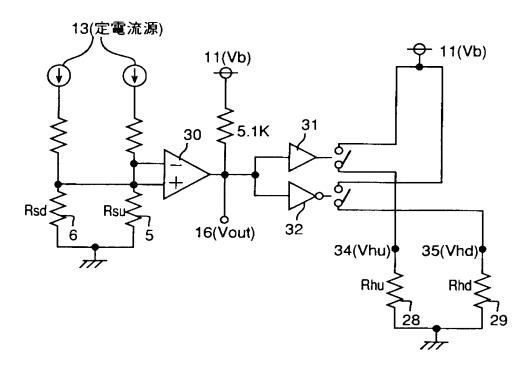


【図7】

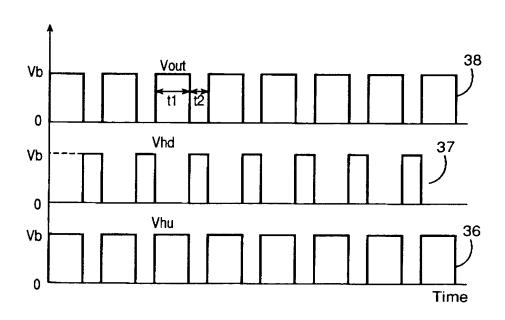


28:上流側温度検出抵抗体 29:下流側温度検出抵抗体

【図8】

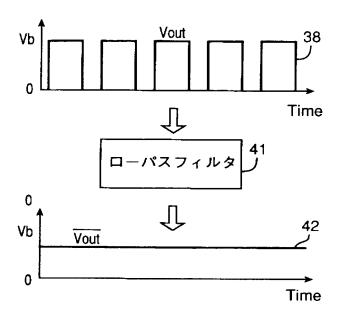


【図9】

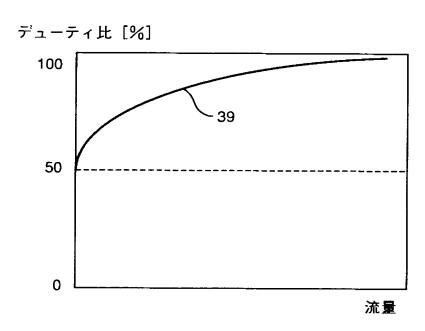


5

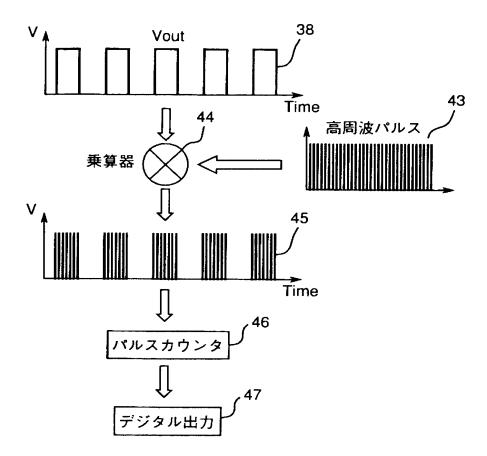
【図10】



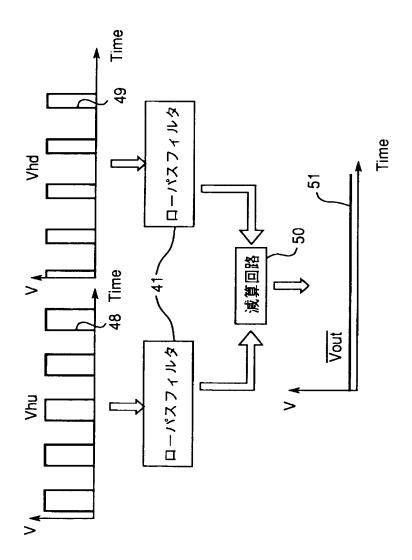
【図11】



【図12】

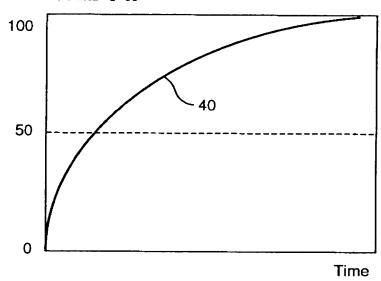


【図13】

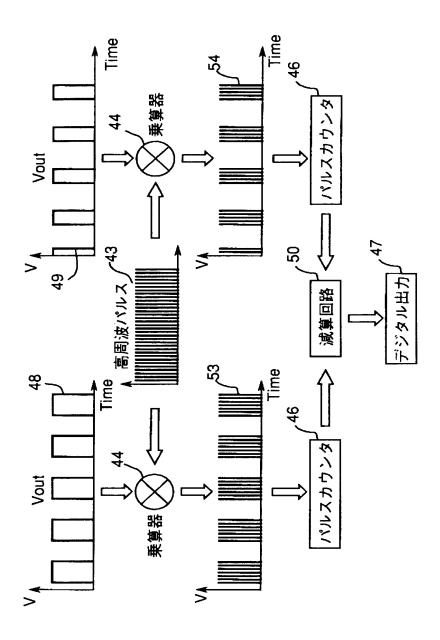


【図14】

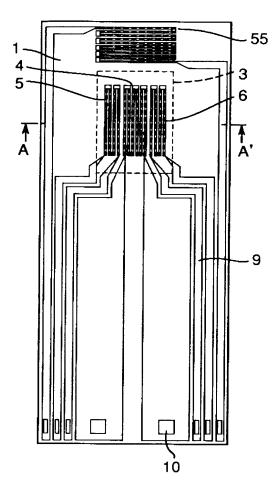
デューティ比差 [%]



【図15】

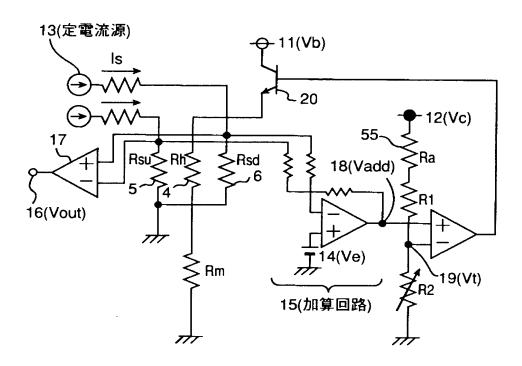


【図16】

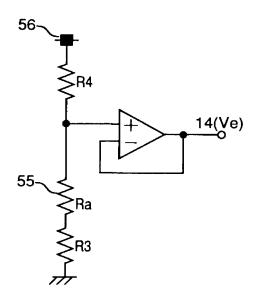


55:流体温度検出抵抗体

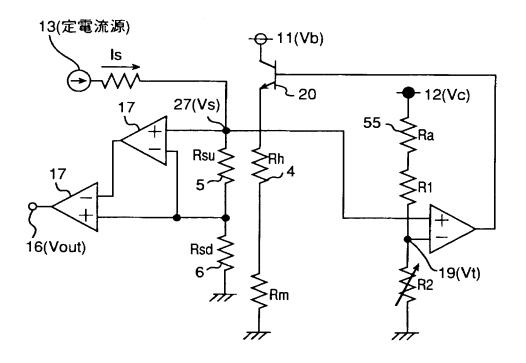
【図17】



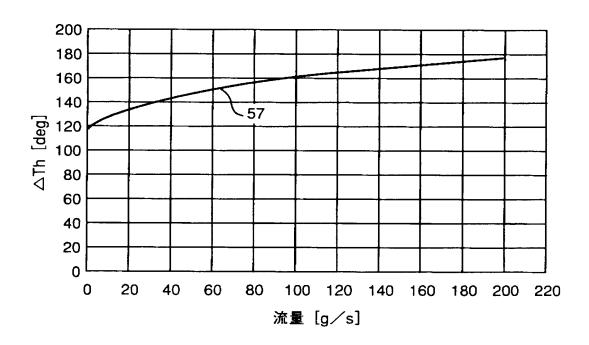
【図18】



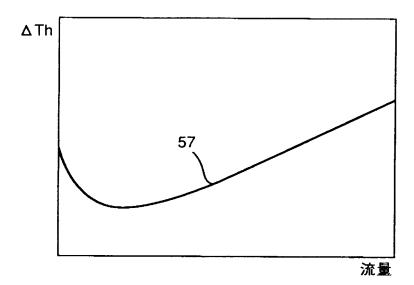
【図19】



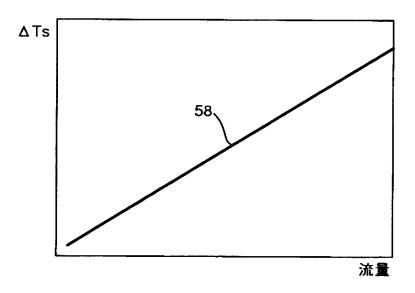
【図20】



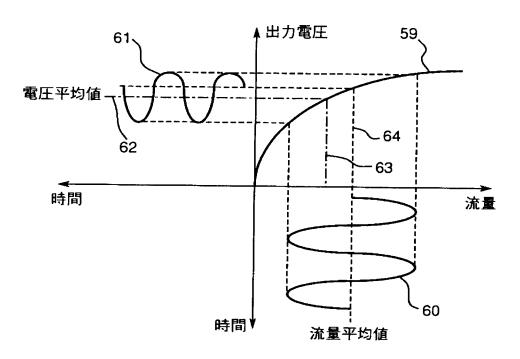
【図21】



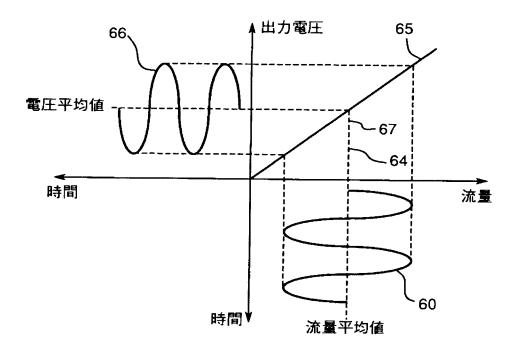
【図22】



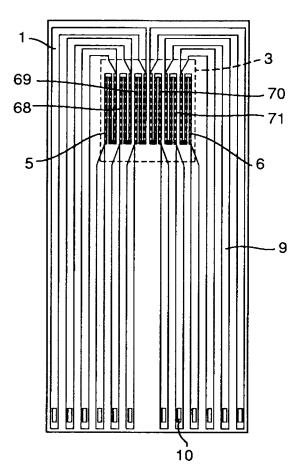
【図23】



【図24】



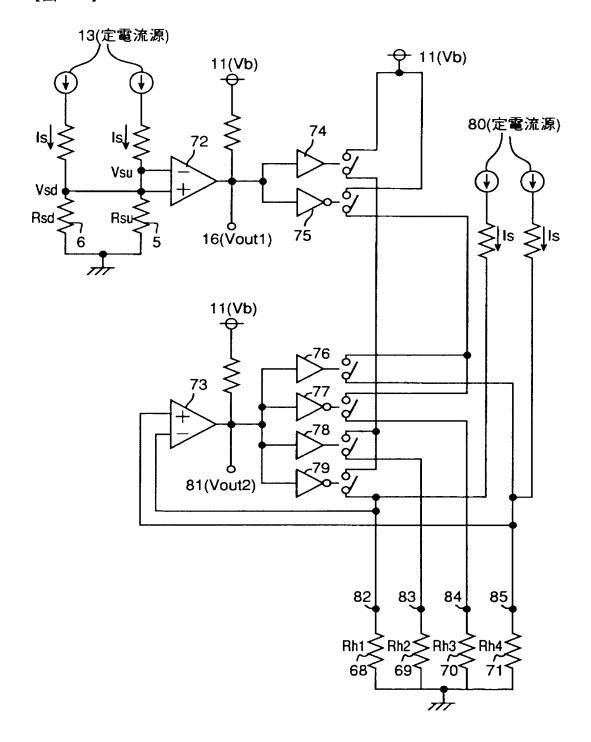
【図25】



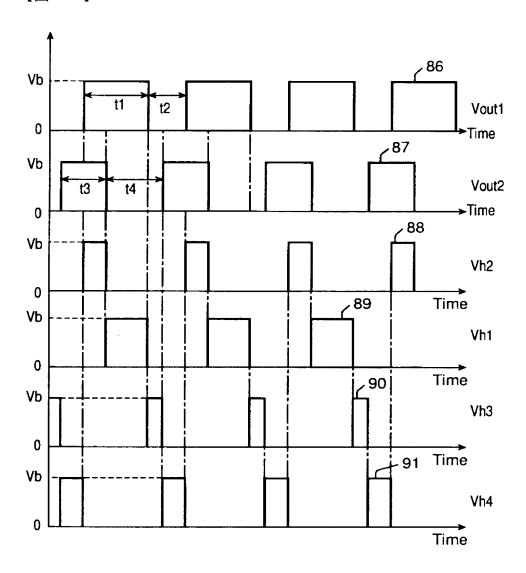
68:第1の発熱抵抗体 69:第2の発熱抵抗体

70:第3の発熱抵抗体 71:第4の発熱抵抗体

【図26】



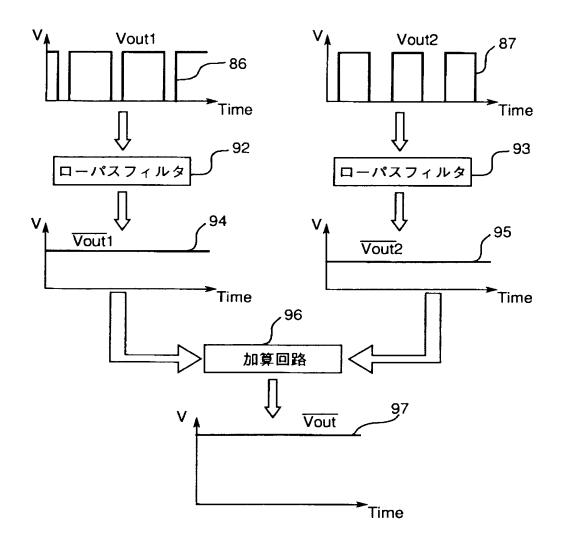
【図27】



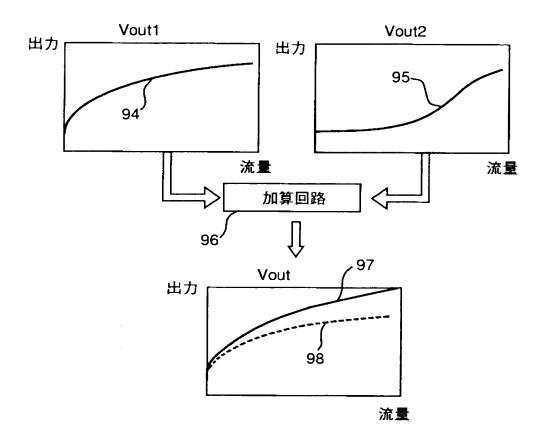
【図28】

Vout1	Vout2	Vh1	Vh2	Vh3	Vh3
High	High	Low	High	Low	Low
High	Low	High	Low	Low	Low
Low	Low	Low	Low	High	Low
Low	High	Low	Low	Low	High

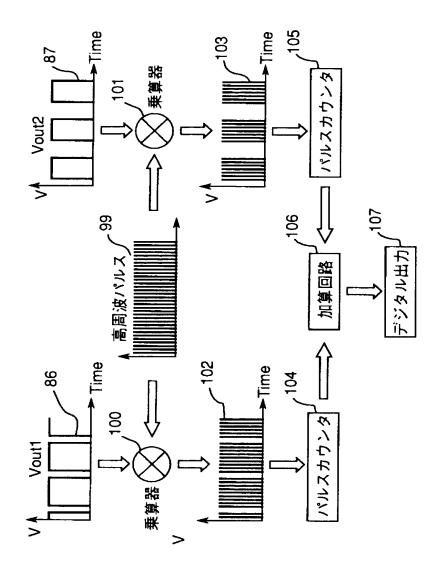
【図29】



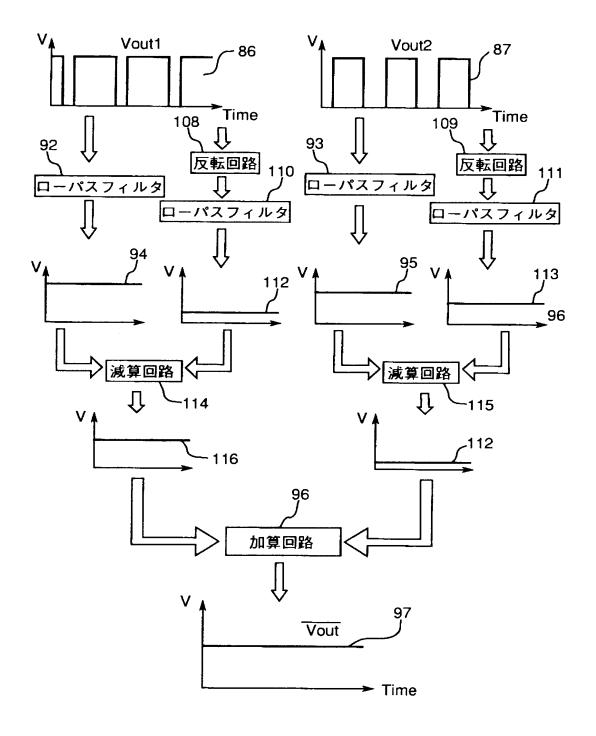
【図30】



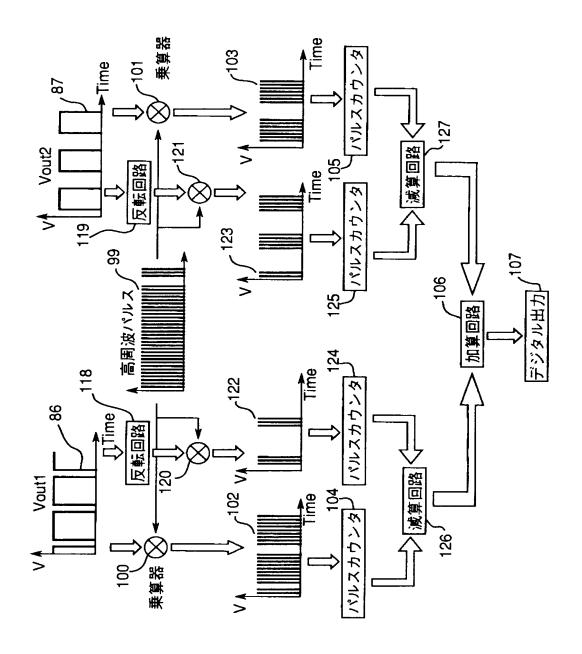
【図31】



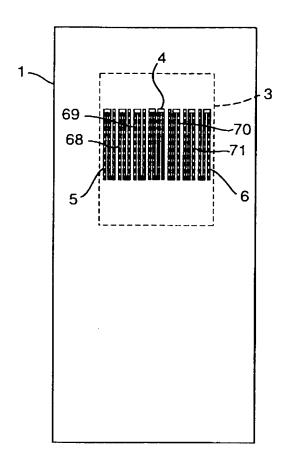
【図32】



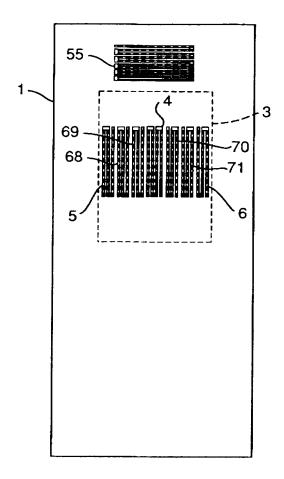
【図33】



【図34】



【図35】



特2001-251434

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 感度および応答性が高く、かつ、ダイナミックレンジが広い流体流量 測定方式を提供する。

【解決手段】 流体中に配置され、熱を発する発熱体の上流側の放熱量と、下流側の放熱量との差から、流体の流量を測定する流量測定装置において、発熱体の上流側に設けられて温度を検出する上流温度検出体と、発熱体の下流側に設けられて温度を検出する下流温度検出体と、上流温度検出体が検出した温度、および、下流温度検出体が検出した温度の平均温度が、予め設定された温度になるように、発熱体に供給する電力を制御する回路とを備えた、流量測定装置を提供する

【選択図】

図3

特2001-251434

出願人履歷情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名 三菱電機株式会社